

Functional test program generation for digital systems

Ubar, Raimund-Johannes; Dušina, Julia; **Krupnova, Helena**; **Storožev, Sergei**; **Zaugarov, Viktor** Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen : proceedings of the 6th workshop, Vaals (Niederlande), March 6-8, 1994 1994 / p. 14-18: ill